



01
K-factorの
自動測定が可能!

02
2in1デバイス
6in1モジュール対応!

03
リアルタイムで
熱抵抗測定が可能!

04
デバイスの
完全破壊前に
試験の停止が可能!

05
チップ温度(Tj)の
正確な測定が可能!

06
設計開発者の
ニーズに応じた試験が可能!

07
デバイスの状態を
リアルタイムに表示

製品特徴

年間200件以上の
受託試験を通じて
培った実績とノウハウ
を全て搭載!

試験のプロが考えた設計開発者のための パワーサイクル試験機(ハイパワーIGBT高電流に対応)

当社の「パワーサイクル試験機」は、大手自動車メーカー様等、設計開発者様からの受託試験を通じて100種類を超える試験システムを開発した経験・ノウハウを元にシステムを統合し製品化したものです。

電源装置1台で
複数DUTを
試験可能

GaN/SiC
次世代デバイス
対応可能

短時間
長時間
モード対応

連続通電
試験にも
対応可能

■ 製品スペック ■		基本モデル	オプション	備考
試験機能	試験デバイス数	4	最大12	
	試験モード	一定電流、一定温度、一定電力		
	温度モニター	熱電対、Tjの直接計測		
	試験停止条件	DUT温度、DUT温度変化量、電圧値、サイクル数、熱抵抗		
	負荷用電源	内蔵:1台 (負荷電流180A)	内蔵:最大3台	1台400A以上 要相談
	試験記録	CSV形式		
試験制御		内蔵PC、液晶モニター、キーボード		
冷却方式		水冷(および空冷)		外付け装置併用
安全機能	試験状態表示	シグナルタワー		
	過熱検知	駆動基板、内部配線(銅バー部)		
	その他 (漏水検知)	(なし)	(各種制御追加可能)	要相談